

박막의 자왜 및 영율 측정

이용호 · 신용돌 · 허복희 · 이금휘

전북대학교 물리학과

전주시 덕진구 덕진동 664-14, 506-756

김희중 · 한석희 · 강일구

한국과학기술연구원 자성합금연구실

서울특별시 성북구 하월곡동, 136-791

이장로

숙명여자대학교 물리학과

서울특별시 용산구 청파동, 140-742

(1994년 3월 24일 받음, 1994년 6월 7일 최종수정본 받음)

박막의 자왜와 그 측정에 연관되는 기판과 박막의 영율 및 자장 중에서 자성체의 영율이 변화하는 ΔE 효과 등을 하나의 장치로 측정하는 방법을 연구하였다. 박막이 증착된 기판을 평면 전극위에 나란하게 외팔보가 되게 지지하면, 전기용량이 형성되고, 그 용량은 시료 자체의 무게, 인가된 자장 및 전기장에 의한 굴곡으로 미소 변화하며 그것을 미소용량 브리지로 검출하여 역학적 계산으로 박막과 기판의 영율과 자왜 및 ΔE 효과를 측정하여 그 결과에 대하여 고찰하였다.

I. 서 론

지금까지 자성박막의 자왜측정에 관하여 수편의 연구 보고[1~5]가 있었으나 아직도 분명치 않는 점이 남아 있다. 박막의 자왜측정은 박막을 기판에서 분리할 수 없기 때문에 자장중에서의 시료의 굴곡을 광학적[3, 4] 또는 미소용량변화[1, 2] 등으로 검출하여 역학적 계산으로 산출하였다. 이때 기판의 기하학적 형상과 영율 및 박막의 영율 등을 정확하게 알아야 하는데 종전의 문헌에서는 시료 자체의 값이 아니라 각 물질의 기준의 bulk 값을 사용하였으며, 자장중에서의 박막의 영율의 증가 즉 ΔE 효과에 대한 고려도 없었다. 그 시료 자신의 박막과 영율을 분리하여 측정하는 방법[6]이 고안되었으나 이에는 특수 장치가 필요하였다. 그리고 박막자왜의 계산식속의 Poisson비에 관한 교정항도 저자에 따라 각각 상이하였다 [1~4]. 본 보고에서는 이상의 문제를 해결하며 또 하나의 장치로 영율과 자왜 및 ΔE 효과를 다 측정할 수 있는 방법에 대하여 연구하였다.

II. 장치의 구성과 측정원리

1. 장치의 구성

본 장치의 구성은 Fig. 1과 같다. 유리기판(두께 a_s ,

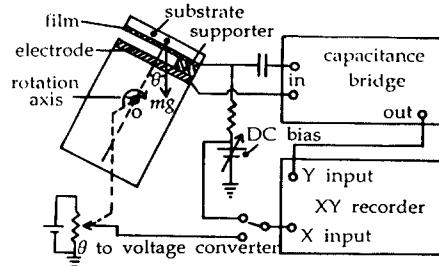


Fig. 1 Block diagram of the measuring system.

폭 b , 길이 l_0 질량 m_s , 영율 E_s) 위에 자성박막(두께 a_f , 영율 E_f)을 증착한 시료를 평면 전극위에 잔격 x_0 로 나란하게 외팔보가 되게 지지하면 전기용량 C_0 ($C_0 = \epsilon_0 b l_0 / x_0$) 가 형성된다. 원통으로 된 시료 홀더의 시료면을 수평면에 대하여 θ 각도로 회전하게 하면 시료 자체에 작용하는 중력의 성분($m_s + m_f$) $g \cos \theta$ 는 시료를 평면 전극 쪽으로 굽히며 용량이 미소변화하여 시료의 자유단이 δ_C 만큼 편향한다. 또 직류바이어스 전압 V 를 시료에 가할 때도 전기력에 의하여 시료가 굽곡되어 자유단이 δ_E 만큼 미소 편향하고 자장을 시료면에 나란하게 하여도 박막의 자왜에 의하여 자유단의 편향 δ_M 가 생긴다. 이 δ_C , δ_E , δ_M 등이 전극간의 잔격 x_0 에 비교하여 매우 작으면

미소용량 부리지의 애너로그 출력 전압은 편향에 비례하므로 XY 기록계에 δ_G 대 θ , δ_E 대 전기장 E , δ_M 대 자기장 $\mu_0 H$ 등의 관계가 기록된다. 이 자료를 써서 다음의 계산식으로 박막의 자외와 영율등을 구할수 있다.

2. 편향의 계산

자체 무게에 의한 편향의 계산식은

$$\delta_G = \frac{3}{2} \cdot \frac{mg}{b} \cdot \left(\frac{l_0}{a_s} \right)^3 \left[E_s \cdot \left(1 + 3 \frac{E_f}{E_s} \cdot \frac{a_f}{a_s} \right) \right]^{-1} \cos \theta \quad (1)$$

과 같다[7]. 이 식의 중력의 성분 $mg \cos \theta$ 대신 전기장 E 에 의한 측정기의 양극판 간의 전기인력 $(1/2) \epsilon_0 E^2 b l$ (l 은 l_0 의 일부로서 전기적 유효길이, $E = V/x_0$ 로서 V 는 직류 바이어스 전압)을 (1)식에 대입하면 전기력에 의한 편향 δ_E 를 구할수 있다.

$$\delta_E = \frac{3}{4} \epsilon_0 E^2 a_s \left(\frac{l_0}{a_s} \right)^3 \left[E_s \cdot \left(1 + 3 \frac{E_f}{E_s} \cdot \frac{a_f}{a_s} \right) \right]^{-1} \quad (2)$$

이때 $\delta_E \ll x_0$ 의 조건이 필요하다. 그리고 자외를 측정하기 위하여 시료를 자장속에 둘때의 편향 δ_M 은

$$\delta_M = 3 \cdot \frac{\ell a_f E_f}{a_s^2 E_s} \cdot \frac{\lambda}{\eta} \quad (3)$$

이 된다[3]. 여기서 η 의 값은 종전의 문헌에서는 저자에 따라 $(1 + v_f) / (1 - v_s)$ [1, 3] 또는 $(1 + v_f) / (1 - v_s^2)$ [2] 또는 1 [4] 등 다양하다. 여기서 λ 는 시료의 자외, v_s 와 v_f 는 각각 기판과 박막의 Poission 비이다. 또 v_s 와 v_f 에 관한 명확한 값은 거의 발표되지 않고 있다[1-4].

III. 실험 및 고찰

1. 시료의 제작 및 용량 브리지

Ni, Ni₅₃Fe₄₇, Ni₈₁Fe₁₉의 박막을 고주파 스피터링 또는 열진공증착으로 현미경의 카버그래스에 증착하였다. 시료의 세원을 Table I에 표시한다.

본 실험에 사용한 용량 브리지는 transformer-ratio-armbridge로서 분해능은 10⁻⁵ pF, 최대 측정용량 30 pF이며 자작하였다.

2. 기판의 영율 측정

자체 무게에 의한 편향 δ_G 와 시료의 회전각도 θ 사이의

Ni₅₃Fe₄₇ 시료에 대한 실험 결과는 Fig. 2와 같다. δ_G 는 θ 의 여현함수가 되어 식(1)의 결과와 일치하고 있다. Fig. 2의 진폭의 실험치 V_G 와 식(1)을 써서 기판의 영율을 계산한 결과는 Table II와 같다. 진폭 V_G 의 값을 0.02 pF에 해당하는 교정용 축전기를 시료의 전기용량 C_0 에 가하였을때의 진폭의 변화 V_{cal} (Fig. 2 속의 직각파)와 비교함으로서 δ_G 가 얻어진다.

Table I. Sample parameters

sample	substrate		film		total mass $m = (m_s + m_f)$ (mg)
	b (mm)	l_0 (mm)	thickness a_s (μm)	Young's Mod. E_f (GPa)	
Ni	7.0	18	0.75	192	46.4
Ni ₅₃ Fe ₄₇	7.0	17.5	1.0	213	47.0
Ni ₈₁ Fe ₁₉	5.3	15.5	1.0	210	32.7

All thickness of the substrates are the same as 0.15 mm. E_f is measured by the mechanical resonance method [6]

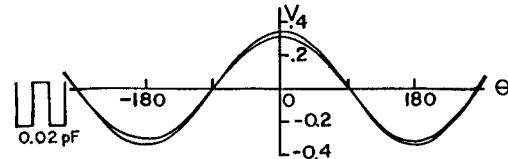


Fig. 2. The gravitational deflection δ_G as the function of the rotation angle θ of Ni₅₃Fe₄₇ sample.

Table II. Young's moduli of the substrates

film	C_0 (pF)	x_0 (μm)	V_G (mV)	V_{cal} (mV)	δ_G (μm)	E_f (GPa)
Ni	7.10	148	670	255	2.19	78.2
Ni ₅₃ Fe ₄₇	4.94	208	286	244	1.96	79.2
Ni ₈₁ Fe ₁₉	4.60	147	335	275	1.56	60.2

V_G and V_{cal} : output of the capacitance bridge due to selfweight and calibration with 0.02 pF of equivalent capacitance adding. For other parameters see the text.

3. 전기장에 의한 편향 δ_E 및 ΔE 효과

직류 바이어스 전압 V 로 생긴 시료 속의 전기장에 의한 편향 δ_E 의 V 에 대한 함수 관계는 Fig. 3과 같다. 용량브리지의 출력 V_E 는 δ_E 에 비례하며 또 그것은 바이어스 전압 V 의 자승에 비례하고 있다. 이것은 식(2)의 결과와 일치한다. ΔE 효과는 자장을 가하지 않을때의 δ_E

의 값 $\delta_E(0)$ 과 자장 H 를 가할때의 값 $\delta_E(H)$ 에 의하여 다음과 같이 계산된다.

$$\varepsilon \equiv \frac{E_f(H) - E_f(0)}{E_f(0)} = \frac{\delta_E(0) - \delta_E(H)}{\delta_E(H)} \left(\frac{a_s E_s}{3a_f E_f} + 1 \right) \quad (4)$$

실험결과를 요약하면 Table III 을 얻는다.

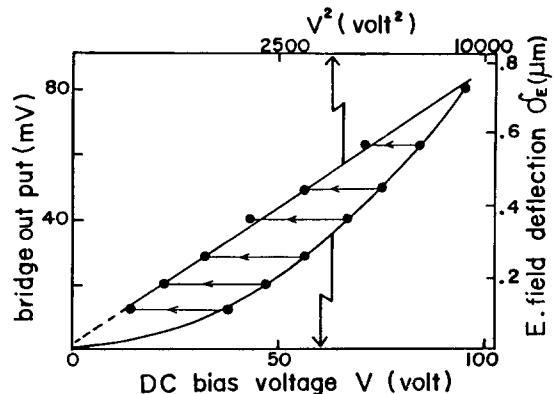


Fig. 3. The electrical deflection δ_E as the function of the applied voltage V of $\text{Ni}_{81}\text{Fe}_{19}$ sample.

Table III. effect and related parameters

film	$\delta_E(0)$ (μm)	$\delta_E(H)$ (μm)	$a_f(\mu\text{m})$	$E_s(\text{GPa})$	$E_f(\text{GPa})$	$\varepsilon(\%)$
Ni	0.977	0.962	0.75	78.2	192	43
$\text{Ni}_{81}\text{Fe}_{19}$	0.460	0.452	1.0	79.1	213	34
$\text{Ni}_{81}\text{Fe}_{19}$	0.723	0.718	1.0	60.2	210	10

$\delta_E(0)$: deflection under electric field and no magnetic field. $\delta_E(H)$: deflection under electric and magnetic field. All applied bias voltage is 92 V.

4. 자외의 측정

자외측정의 한예로서 Ni 및 $\text{Ni}_{81}\text{Fe}_{19}$ 박막시료의 자장 속에서의 편향 δ_M 의 자장 $\mu_0 H$ 및 시료의 방향각 θ 의 의존성을 Fig. 4 및 5에 표시한다. 각 곡선의 peak to peak 값 $\Delta\delta_M$ 은 $\delta_M(\theta=0^\circ) - \delta_M(\theta=90^\circ)$ 와 같다. $\Delta\delta_M$ 을 자장 $\mu_0 H$ 에 대하여 다시 그리면 Fig. 6이 되고, 포화영역의 직선을 외삽하여 $H=0$ 에서의 $\Delta\delta_M$ 의 값 즉 $\Delta\delta_M(H=0)$ 을 구하면 포화자외 λ_s 는

$$\lambda_s = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{E_s}{E_f} - \frac{\Delta\delta_M(H=0)}{a_f} \cdot \left(\frac{a_s}{l} \right)^2 \eta \quad (5)$$

에 의하여 계산된다. 각 시료의 λ_s 를 계산한 결과를 Table IV에 표시한다.

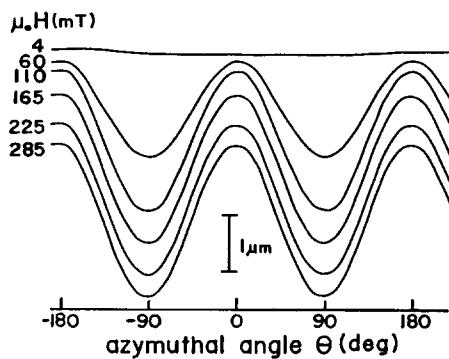


Fig. 4. The magnetical deflection δ_M as the functions of the applied field $\mu_0 H$ and azimuthal angle θ of Ni sample

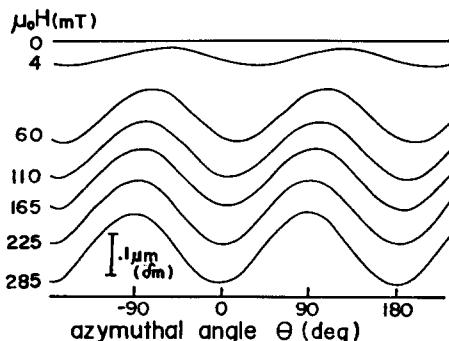


Fig. 5. The magnetical deflection δ_M as the function of the applied field $\mu_0 H$ and azimuthal angle θ of $\text{Ni}_{81}\text{Fe}_{19}$ sample

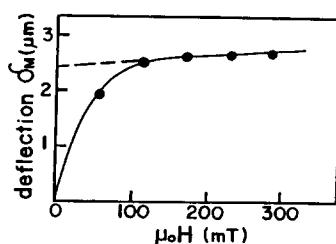


Fig. 6. Replotted graph of Fig. 4 to calculate the magnetostriction of Ni sample

Table IV. Magnetostriction data

film	$\Delta\delta_m(H=0)$ (μm)	$\lambda_s(10^{-6})$			
		$\eta = 1$	$\eta = (1+v_f)/(1-v_s)$	$\eta = (\epsilon+1)$	Bozorth [9]
Ni	2.43	18.6	31.3	26.6	25.5(Ni ₈₂ Fe ₁₈)
Ni ₈ Fe ₆	1.80	16.4	27.6	22.0	25.0(Ni ₈₁ Fe ₁₉) (Ni _{81.5} Fe _{18.5})
Ni ₈ Fe ₈	0.13	0.81	1.36	0.89	2.5(Ni ₈₁ Fe ₁₉)

$v_s = 0.24$, $v_f = 0.28$ [8], then $\eta = (1+v_f)/(1-v_s) = 1.68$

이 결과에서 보면 $\eta = 1$ 로 하면 λ_s 의 값은 기존 문헌의 값보다 상당히 작아지고 $\eta = (1+v_f)/(1-v_s)$ 로 하면 문헌보다 약간 커지며 ΔE 효과의 실험치 ϵ 에 의하여 박막의 영율이 자장인가시($\epsilon+1$) E_f 가 되었다고 가정하면 약간 적은 값을 얻는다.

IV. 결 론

한 장치에 의하여 박막의 자외측정에 필요한 기판 및 시료의 영율과 자외를 측정하는 방법이 완성되었으며 자외가 거의 0인 퍼머로이 박막도 충분한 정밀도로 측정되었다.

자외측정의 분해능은 10^{-7} 이상이며 Poisson 비에 의한 교정인자의 문제도 밝혀졌다.

그러나 ΔE 효과는 bulk 시료의 값보다 매우 커져서 그 기구에 관하여는 앞으로의 연구가 남아있다.

감사의 글

본 연구는 교육부의 기초과학 지원연구사업 BSRI 93-213과 과학기술처의 특정연구사업의 지원을 받았음.

참 고 문 헌

- [1] E. Klokholm, IEEE Trans. Magn. **MAG-12**, pp. 819-821, September 1976.
- [2] D. W. Forester, C. Vittoria, J. Schelleng and P. Lubitz, J. Appl. Phys. **49**, pp. 1966-1968, March 1978.
- [3] A. C. Tan and H. Schroeder, J. Appl. Phys. **64**, pp. 5422-5424, November 1988.
- [4] M. Kaneko, S. Hashimoto, M. Hayakawa and K. Aso, J. Phys. E : Sci. Instrum. **21**, pp. 487-489, 1988.
- [5] K. I. Arai, M. Yamaguchi and C. S. Muranaka, IEEE Trans. Magn. **MAG-25**, pp. 4201-4203, September 1989
- [6] 이용호, 신용돌, 이장로, 응용물리 6, pp. 290-293 (1993)
- [7] 한국물리학회, 응용물리 (1994. 7월호)에 게재 확정
- [8] Y. Fukumoto, General Physics Experiment (일본문) p 255 (Riko Publishing Co. Tokyo, 1951)
- [9] R. M. Bozorth, Ferromagnetism, D. Van Nostrand Co, London (1968) p. 667

Thin Film Magnetostriction and Young's Modulus Measurement

Y. H. Lee, Y. D. Shin, P. H. Herr and K. H. Lee

Dept. of Physics, Jeonbuk National University, Jeonju 560-756 Korea

H. J. Kim, S. H. Han and I. K. Kang

Magnetic Alloys Lab. Korean Institute of Science and Technology, Seoul, 136-791 Korea

J. R. Rhee

Dept. of Physics, Sookmyung Women's University, Seoul 140-742 Korea

(Received 24 March 1994, in final form 7 June 1994)

Abstract—This paper reports a method measuring magnetostriction, Young's moduli of a substrate and film and ΔE -effect with one apparatus. A substrate deposited with a thin magnetic film is parallelly cantilevered parallel to a metal plate electrode, forming a capacitive cell. The cantilever deflects due to own weight, applied electric and magnetic field. The small change of the capacitance caused by this deflection is measured by a sensitive capacitance bridge. Young's modulus, magnetostriction and ΔE effect can be calculated by theoretical analysis with the weight, applied field and deflection data.